

Изменение № 3 ГОСТ 12228.1—78 Рутений. Метод спектрального анализа
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2252

Дата введения 1997—09—01

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 12228.1—78)

Вводная часть. Первый абзац после слова «свинца» дополнить словами: «титана, осмия, олова»;

второй абзац. Заменить слова: «переменного тока» на «переменного и постоянного токов».

Раздел 2. Второй абзац. Заменить слова: «переменного тока» на «переменного и постоянного токов»;

одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «Фотопластинки spectroграфического типа ЭС чувствительностью 5 — 10 ед. или другие контрастные фотоматериалы».

Пункт 3.1. Второй абзац. Исключить слова: «и тщательно растирают с 200 мг графитового порошка в течение 30 мин».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. Спектры градуировочных образцов и проб фотографируют на spectroграфе при следующих условиях: ширина щели 0,015 мм, освещение щели трехлинзовым конденсором, сила постоянного тока 10 А, экспозиция 60 с. Межэлектродное расстояние 2,5 мм устанавливают и поддерживают постоянным в течение экспонирования спектров по изображению на промежуточной диафрагме. Электрод с анализируемой пробой является анодом. При определении примесей, массовая доля которых: Pt, Fe, Ti — более 0,01 %; Pd, Mg, Si — более 0,003 %; Rh, Ni, Pb, Au, Sn — более 0,005 %; Ag, Cu, Al — более 0,001 %; Iг — более 0,025 % от аналитической пробы отбирают навеску в 100 мг и тщательно растирают с 200 мг графитового порошка в течение 30 мин. Спектры градуировочных

(Продолжение см. с. 19)

образцов и проб фотографируют в дуге переменного тока силой 7 — 8 А, экспозиция 90 с. Для определения бария спектры градуировочных образцов и проб фотографируют при силе тока 7 А, экспозиция 45 с. Для определения осмия от аналитической пробы отбирают навеску 400 мг и тщательно перемешивают с 400 мг окиси меди (CuO) в течение 30 мин. Спектры градуировочных образцов и проб фотографируют в дуге переменного тока силы 8 — 10 А, экспозиция 90 с. Спектры фотографируют на высококонтрастные фотоматериалы (пластинки, пленку). Фотопластинки (фотопленки) проявляют в течение 5 мин при температуре проявителя 20 °С. Проявленные фотопластинки и фотопленки ополаскивают в воде, фиксируют, промывают в проточной воде, высушивают и фотометрируют.

Пункт 5.1. Таблица 1. Головка таблицы. Графа «Длина волны, нм». Заменить

(Продолжение см. с. 20)

слова: «Аналитической линии» на «аналитической линии»; «Внутреннего стандарта» на «линии «внутреннего стандарта»;
дополнить новыми элементами с соответствующими длинами волны:

| Определяемый элемент | Длина волны, нм | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | аналитической линии | линии «внутреннего стандарта» |
| Титан | 307,86 | 307,66 |
| Осмий | 315,63 | 315,07 |
| Олово | 326,23 | 326,65 |

(ИУС № 5 1997 г.)